



令和6年度第3回機器分析・計測セミナー

スキャナタイプ画像解析装置 Amersham™ Typhoon™ NIR Plus のご紹介

本年度、新たにスキャナタイプ画像解析装置が導入されました。機能やアプリケーションのご紹介をオンラインにて行います。

装置：スキャナタイプ画像解析装置

Amersham™ Typhoon™ NIR Plus

日時：令和6年12月24日(火)10:00～11:00

内容：機能とアプリケーション事例の紹介

形式：オンライン形式（Microsoft Teams）※

講師：Cytiva 山縣 久美 氏

申込：下記URL(GoogleForms)にて申込み下さい。

<https://forms.gle/CRhTU1yeQHB4amKn6>

申込期限：令和6年12月23日(月)午前10時

※申し込みいただいた方に12/23(月)午後にミーティングURLをメールでお伝えいたします。



Amersham™ Typhoon™ NIR Plus